# 用辐射测量法研究CuI激光振荡的增益特性

薛焕然

张耀宁 龚志伟 丘军林

(华东工学院)

(华中工学院激光研究所)

本文在自行设计的全金属铜空心阴极激光器上获得了Cu I 740.4nm (6S³D₃—5P³P₂°) 谱线的激光振荡。为了研究最佳的激光运行条件,用辐射测量方法测量了该谱线在不同的激发条件下的增益特性。对测量结果进行了讨论。得出结论:在He-Ar-Cu放电、He:Ar为4:1时,Cu I 740.4nm 谱线增益最大。所得结论和实际的激光输出特性基本一致。

Gain characters of Cull laser oscillation studied

with radiation measurement?

Xue Huanran

(East China Institute of Technology)

Zhang Yaoning, Gong Zhiwei and Qiu Junlin

(Institute of Laser, Huazhong University of SCience and Technology)

Abstract

The laser oscillation of Cu I 740.4nm (6S 3D 3-5P 3P 20) line is obtained with the full metal copper hollow cathode laser designed by the authors. To study optimum condition of laser operation, gain characteristic of the line is measured with radiation measurement under a variety of exciting condition. Measuring results are discussed. The authors come to the conclusion that gain of Cu I 740.4nm is maximum when He: Ar equals 4:1 in the case of He-Ar-Cu discharge. The conclusion is in good agree with practical laser output characteristic.

铜离子激光器以其众多的激光谱线而引起了人们广泛兴趣。十多年来,人们 已 在 近 红外、可见光和紫外波段发现了近60条Cu II 激光谱线。我们在自制的全金属槽型空心 阴 极 铜离子激光器上获得了Cu II 780.8nm和740.4nm两条激光振荡。为研究激光运行的最佳条件,我们用辐射测量法研究了不同激发条件下,Cu II 740.4nm激光振荡的增益特性。

#### 一、辐射测量法测增益的物理基础

假定所研究的谱线上能级为j能级,下能级为k能级,统计权重分别是 $g_i$ 和 $g_i$ ,自发辐射几率为 $A_{ii}$ ,线型函数为 $g_{ik}(\nu,\nu_o)$ ,反转粒子数是 $\Delta n_{ik}$ ,谱线中心波长为 $\lambda_{ik}$ ,则谱线的增益系数 $G_{ik}$ 可表示为。

$$G_{ik} = \Delta n_{ik} \frac{\lambda_{ik}^2}{8\pi} A_{ik} g_{ik} (\nu, \nu_0)$$
 (1)

自发辐射几率Ail和吸收振子强度fli有下列关系:

$$A_{ik} = \frac{g_k 2\pi e^2 v_{jk}^2}{g_j \varepsilon_0 m_s c^3} f_{kj}$$
 (2)

在铜离子激光器中, 谱线占优的增宽机制是Doppler增宽, 所以又有:

$$G_{ik} = (n_i - \frac{g_i}{g_k} n_k) \frac{g_k e^2 f_{ki}}{g_i 2 \epsilon_0 m_o c} \cdot \frac{1}{\Delta v_D} (\frac{\ln 2}{\pi})^{1/2} \cdot \exp\left(-\frac{4 \ln 2 (v - v_0)^2}{\Delta v_D^2}\right)$$
(3)

式中, ni和ni分别是上、下能级的粒子数密度, Δνο是Doppler线宽。

令v=v。,得到谱线中心的增益系数:

$$G_{ik} = \left(\frac{n_i}{g_i} - \frac{n_k}{g_k}\right) \frac{e^2 \lambda_{ik}}{4\epsilon_n m_e c} \sqrt{\frac{m_{cu}}{2KT\pi}} g_k f_{ki}$$
(4)

从上式可见,为求出增益系数 $G_{ik}$ ,先要求得上、下能级的粒子数密度,而粒子 数密 度可以由辐射功率测量得到。自发辐射功率 $\Phi_{ik}$ 可表示为,

$$\Phi_{ik} = N_i A_{ik} h y_{ik} \tag{5}$$

将Air与fri的关系式代入上式,并令ni=Ni/V (V为发射等离子体体积),则有

$$\Phi_{ik} = N_i h \nu_{ik} \frac{g_k 2\pi e^2 \nu_{ik}^2}{g_i \varepsilon_0 m_o c^3} f_{ki} \frac{n_i 2\pi e^2 h V}{g_i m_o \varepsilon_0 \lambda_{ik}^3} g_k f_{ki}$$
(6)

所以有:

$$\frac{\mathbf{n}_{i}}{\mathbf{g}_{i}} = \frac{\Phi_{ik}\lambda_{ik}^{3}\mathbf{m}_{i}e_{0}}{\mathbf{g}_{k}f_{ki}2\pi\epsilon^{2}hV} \tag{7}$$

因为自发辐射是各向同性的, 所以可得:

$$\Phi_{jk} = 4\pi I_{jk} \tag{8}$$

式中, 1, 为辐射强度。如果我们在某一固定方向测量辐射功率, 则此辐射功率为:

$$\Phi_{i,m} = \Omega I_{i,m} \tag{9}$$

(9) 式中Ω是测量系统接收元件对待测发射等离子体所张立体角。由(8)、(9)式:

$$\Phi_{ik} = \frac{4\pi}{\Omega} \cdot \Phi_{ik} m \tag{10}$$

由于等离子体对谱线有吸收,因此对辐射测量的结果应加以修正。考虑吸收 后, 辐射 功率为:

$$\Phi_{ik} = \frac{e_v}{k_v} (1 + e^{-kv}l) \tag{11}$$

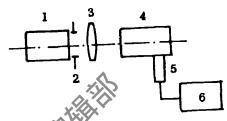
式中, e、为 遵线 发 射 系 数, k、 为 吸 收 系 数、 /为 放电长 度。 因 为 e 、/ = Φ n. 所 以 又

$$\Phi_{ik} = \frac{k_{\nu} l}{1 - e^{-k\nu l}} \Phi_{ik}^{a}$$
 (12)

因此,对测量得到的辐射功率修正的系数是 $\frac{k_v}{1-c_v k_v}$ 。实际上,当 $k_v$ ?<0.05时,修 正因子为1.025、相对误差不超过2.5%,可以不作修正。

我们所用的实验装置如图1所示。实验装置分为放电管和接收系统两部分。放电管是管

壳材料为不锈钢的全金属放电 管, 阴极长 30cm, 内有\phi6mm的通孔通水冷 却, 表 面 开有1.5×4.5mm的矩型槽, 电极材料为高 导无氧铜, 电极间距 5 mm。接收系统由 光 阑、透镜、紫外可见光单色仪、光电倍增管 和X-Y记录仪组成,光阑用来限制等离子体 对单色仪狭缝的张角,有1200线 对/mm的 平面光栅紫外可见光单色仪实现分光, 其出 射光信号通过光电倍增管放大,再馈入X-Y 记录仪,而后输出电压信号,该电压信号与 光谱辐射功率成正比。在我们关心的红光波段、光电倍增管在线性范围工作。



实验装置图。

全金属放电管;2。光阑; 透镜:4.紫外-可见光单色 仪; 5.光电倍增管:6. X-Y

在实验期间,我们对接收系统的光谱灵敏度作了标定。标定步骤是:

1.以色温为2800K的钨带灯作标准光源,确定钨带的光谱辐射亮度 $L_{19}(\lambda,T)$ , 它可由

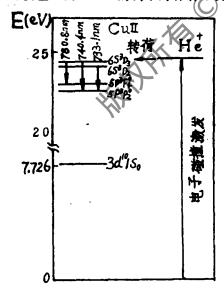


图 2 Cu 1740.4nm 谱线能级图

- Planck定律和光谱发射率ezg导出。钨 带 灯 所配置的晶体管直流稳流器电流稳 定 度 小 于 $\pm 0.01\%/min$ .
- 2. 根 '据 V<sub>λ</sub>(λ) ∝ Lλ<sub>θ</sub>(λ, T) E<sub>λ</sub>(λ) 确定 接 收系统的相对光谱灵敏 度。此处, V<sub>λ</sub>(λ) 为 X-Y记录仪上的电压信号 值, E1(1)是包 括 单色仪和光电倍增管在内的接收系统相对光 谱灵敏度。
- 3.在上述相对光谱灵敏度测量范围内的 一个特定波长上补充测量绝对光谱灵敏度, 以得到接受系统在该范围内的绝对光谱灵敏 度。我们利用单色性好的He-Ne激光器作辐 射源,测量632.8nm谱线的绝对光谱灵敏度。 每次测量开始和结束时,均 用SER·N°210 绝

对辐射计测量632.8nm谱线的辐射功率,在测量工作期间,器件稳定度和测量重复性均很好。

## 三、能级粒子数密度的决定

740.4m 谱线的能级结构如图 2 所示。通过分别衡量以Cu I 6S \*D<sub>3</sub> 和5P \*P<sub>2</sub> \*P<sub>3</sub> 为上能级的 谱线自发辐射功率,就可以确定上、下能级的粒子数密度。对于上激光能级,我们 选 取 以 6S \*D<sub>3</sub> 为上能级各谱线中最强的780.8nm 谱线作辐射测量,该谱线吸收系数很小,f<sub>2</sub> 测量 值 为2.415。考虑下激光能级,以Cu I 5P \*P<sub>2</sub> \*0 为上能级的自发辐射谱线,如827.8nm (5P \*P<sub>2</sub> \*P<sub>3</sub> \*P<sub>3</sub>

在Doppler增宽占优的条件下,谱线中心的吸收系数kv。与下能级的粒子数N有如下关系[1]。

$$N=8.64\times10^{18}\left(-\frac{k_{v_0}}{\lambda f_{k_1}}\right)\left(\frac{T}{m_{cs}}\right)^{1/2}\left[1/m^{8}\right]$$
 (13)

式中, T在放电温度, m., \*为铜原子量。

kv.可利用McConkey[1]方法求出。根据图 3 可以推出下列关系:

$$\frac{\Phi_{R}}{\Phi_{D}} = R \frac{\int_{0}^{1} \left[ \frac{Wh}{(a+x)^{2}} + \frac{2\theta_{1}W + 2\theta_{2}h}{a+x} + 4\theta_{1}\theta_{2} \right]}{\int_{0}^{1} \left[ \frac{Wh}{(a+x)^{2}} + \frac{2\theta_{1}W + 2\theta_{2}h}{a+x} + 4\theta_{1}\theta_{2} \right]}$$

$$\cdot \frac{e^{-\omega^{2}}e^{-Lv0}l^{e^{-\omega^{2}}}e^{-Lv0}l^{e^{-\omega^{2}}}e^{-Lv0}l^{e^{-\omega^{2}}}dxd\omega}{e^{-\omega^{2}}e^{-K_{V}0}Xe^{-\omega^{2}}dxd\omega} \qquad (14)$$

式中,R是反射镜对某一波长 辐射的 反射 本, $\Phi_R$ 和 $\Phi_D$ 分别是反射镜引入光路 前、后测得的该波长的辐射功率,l是 放 电 长度,w、h分别是单色仪狭缝的宽和高, $\omega$  为 参

变量, 
$$\omega = \frac{2(\nu - \nu_0)}{\Delta \nu_D} \sqrt{\ln 2}$$
,  $\theta_i$ ,  $\theta_i$ 分别是

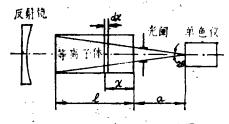


图 3:测量kva的光路图

等离子体对单色仪狭缝在高和宽方向所张夹角。用实验方法测定R,由辐射测量 结果 决定  $\Phi_R/\Phi_D$ ,则可由式 (14) 用数值方法求解 $kv_0$ ,从而确定N。

在与740.4nm 请线共下能级的各请线中,我们选取733.1nm 请线来决定Cu I 5p³P₂°能级的粒子数。从发射光谱分析可知,与733.1nm 请线共上能级6S°D₂的各谱线自 发辐射 均很弱,而且与740.4nm 谱线共下能级的其它谱线自发辐射也较弱。因此,Cu I 5P°P₂°能级密度主要由740.4nm 谱线的自发辐射决定,并且5P°P₂°的集居数远大于6S°D₂能级的集居数,733.1nm 谱线吸收测量能较准确地反映740.4nm 谱线下能级Cu I 5P°P₂°粒子数集居情况。

由辐射测量确定粒子数还需知道振子强度fii值,根据辐射强度比,可从已知的 且 共 上 能级的跃迁谱线fii值推知未知的谱线fii值。即从 (6) 式可推得:

$$\mathbf{f}_{ki} = \mathbf{g}_{i} \mathbf{f}_{ii} \cdot \left( \frac{\lambda_{ik}}{\lambda_{ii}} \right)^{\frac{a}{2}} \frac{\Phi_{ii}}{\Phi_{ji}} \cdot \frac{1}{\mathbf{g}_{k}}$$

$$\tag{15}$$

式中, $\Phi_1$ 为振子强度值 $f_1$ ,已知的谐线的辐射强度, $\lambda_1$ 为该谐线波长。我们测得733.1nm谐线的 $f_{k_1}$ 值为0.521。对于放电温度T值,许多研究者测得在1000~1500K之间 $1^{2,3}$ ],我们取为1250K,这样引起的误差不超过10%。至此,就可以由(7)、(13)式确定Cu 740.4nm谐线上、下能级的粒子数密度。图 4 是不同激发条件下Cu 8 65  $^{3}$ D<sub>3</sub>、5P  $^{3}$ P,  $^{0}$ 能级的n/g值。

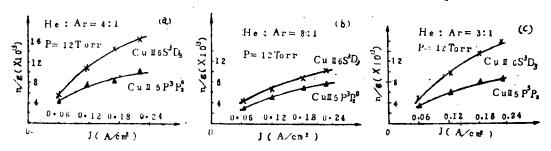


图 4 Cu 1740.4nm 谱线上、下能级的n/g值

### 四、增益、特性、

在求得各能级粒子数密度后,由(4)式就能得到Cu I 740.4nm 谱线中心的增益系数。

- (1) 在He-Ar-Cu和He-Ne-Cu放电中谱线的增益(见图5)。
- (2)不同气体混合比下谱线的增益(见图6)

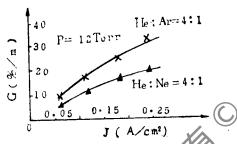


图 5 Cu II 740.4nm 借线在不同混合气体下的增益特性曲线

从上面的增益特性曲线,可以得到下述 结论.

- 1.在大电流密度(j>0.1A/cm²)情况下,增益与电流密度呈线性关系。这一现象也为其他研究者所观察到[4]。
- 2.He Ar-Cu放电时谱线增益高于He-Ne-Cu放电时谱线的增益。这是因为CuI740.4nm谱线上能级6S3D3是通过缓冲气体离子He+与铜原子之间的转荷反应He++

 $Cu\rightarrow Cu^+$  (6S  $^8D_3$ ) —  $He+\Delta E$  而有选择地集居的,Ar对铜的溅射率高于Ne对铜的溅射率,结果铜原子密度较大,反转集居数增加,从而He-Ar-Cu放电时谱线增益较高。

3.气体混合比影响增益,这对He-Ar-Cu放电比He-Ne-Cu放电更明显。利用这一结论可为寻找最佳的激光运行参数提供依据。从上面的曲线看,当He:Ar或He:Ne为4:1时增益最大,这与

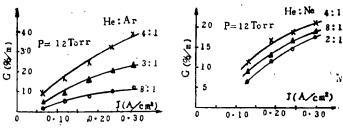


图 6 Cu 1740.4nm谱线在不同气体混合比下的增益特性曲线

激光运行时,气体最佳混合比的实验结果基本吻合。

4. 若根据激光运行时的阈值电流密度,采用外推法,可以求得谱线阈值条件下的小信号

**糟益系数**。在He: Ar为4: 1时, Cu I 740.4nm 谱线激光阈值电流为1.9A, 由此推得其阈值 条件下的小信号增益系数约为8.5%/m。

#### 参考文献

- [1] John W. McConkey, J. O. S. A., 1969, Vol. 59, No. 10, P. 1262~1266.
- (2) P.H. M. Vaessen et al., Phys. Lett., 1978, Vol. 68A, No. 2, P. 204~206.
- (3) B. E. Warner et al., IEEE. J. Q. E, 1978, QE-14, No. 8, P. 568~570.
- (4) H.J. Eichler et al., Opt. Comm., 1980, Vol, 34, No, 2, P. 228~230.

收稿日期: 1987年8月10日。

•中国科学院科学基金资助课题。本文曾在第八届全国激光学术报告会 (1986.9西安) 上宣读。

简 试。

# 成电研制的彩扩机滤色镜通过鉴定

大型彩色扩印机硬膜长方形前置滤色镜和圆形切光片一套(品红色、青色和黄色共六种),由成都电讯工程学院光电子技术系研制成功。该成果于1987年12月8日通过局级鉴定。所研制的滤色镜耐磨、耐高温,经四川省彩色摄影中心等四家的柯达大型彩扩机上长期使用表明,滤色镜性能稳定、膜层完好,与进口滤色镜扩印出的彩照相比无差异,其光谱透射特性达到进口滤镜的水平,扭转了滤色镜依靠进口的局面。

(成光 供稿)